

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

**60603-7-5**

Première édition  
First edition  
2007-03

---

---

**Connecteurs pour équipements électroniques –**

**Partie 7-5:**

**Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 250 MHz**

**Connectors for electronic equipment –**

**Part 7-5:**

**Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz**



Numéro de référence  
Reference number  
CEI/IEC 60603-7-5:2007

## Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

## Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

## Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tél: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

## Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

## Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

## Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site ([www.iec.ch](http://www.iec.ch))
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site ([www.iec.ch/searchpub](http://www.iec.ch/searchpub)) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications ([www.iec.ch/online\\_news/justpub](http://www.iec.ch/online_news/justpub)) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: [custserv@iec.ch](mailto:custserv@iec.ch)  
Tel: +41 22 919 02 11  
Fax: +41 22 919 03 00

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC

60603-7-5

Première édition  
First edition  
2007-03

---

---

**Connecteurs pour équipements électroniques –**

**Partie 7-5:**

**Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 250 MHz**

**Connectors for electronic equipment –**

**Part 7-5:**

**Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz**

© IEC 2007 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE XD

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	10
INTRODUCTION.....	14
1 Généralités.....	16
1.1 Domaine d'application .....	16
1.2 Références normatives.....	16
2 Désignation de type CEI.....	20
2.1 Termes et définitions.....	22
3 Caractéristiques communes et vue isométrique .....	24
3.1 Vue isométrique .....	24
3.2 Informations relatives à l'accouplement.....	24
4 Terminaisons de câble et connexions internes – embases et fiches.....	40
4.1 Généralités.....	40
4.2 Types de sorties.....	40
5 Calibres.....	42
5.1 Embases .....	42
5.2 Fiches .....	48
6 Caractéristiques .....	52
6.1 Généralités.....	52
6.2 Affectation de groupement des broches et des paires.....	52
6.3 Classification en catégories climatiques .....	52
6.4 Caractéristiques électriques.....	54
6.5 Caractéristiques de transmission.....	58
6.6 Caractéristiques mécaniques.....	64
7 Essais et programmes d'essai .....	64
7.1 Généralités.....	64
7.2 Disposition pour l'essai de la résistance de contact.....	66
7.3 Disposition pour l'essai de vibration (phase d'essai CP1).....	68
7.4 Procédures d'essai et méthodes de mesure .....	68
7.5 Préconditionnement.....	68
7.6 Câblage et montage des spécimens .....	70
7.7 Programmes d'essais .....	70
Annexe A (normative) Procédure de continuité de calibrage .....	88
Annexe B (normative) Fonctionnement mécanique du dispositif de verrouillage.....	96
Annexe C (normative) Exigences pour la fiche d'essai .....	98
Annexe D (normative) Exigences générales pour le montage de mesure .....	146
Annexe E (normative) Perte d'insertion.....	156
Annexe F (normative) Affaiblissement de réflexion.....	160
Annexe G (normative) Paradiaphonie .....	164
Annexe H (normative) Télédiaphonie .....	168
Annexe I (normative) Impédance de transfert.....	172
Annexe J (normative) Perte de conversion transversale (TCL) et perte de transfert de conversion transversale (TCTL).....	186

## CONTENTS

FOREWORD.....	11
INTRODUCTION.....	15
<b>1 General.....</b>	<b>17</b>
1.1 Scope.....	17
1.2 Normative references.....	17
<b>2 IEC type designation.....</b>	<b>21</b>
2.1 Terms and definitions.....	23
<b>3 Common features and isometric view.....</b>	<b>25</b>
3.1 Isometric view.....	25
3.2 Mating information.....	25
<b>4 Cable terminations and internal connections – fixed and free connectors.....</b>	<b>41</b>
4.1 General.....	41
4.2 Termination types.....	41
<b>5 Gauges.....</b>	<b>43</b>
5.1 Fixed connectors.....	43
5.2 Free connectors.....	49
<b>6 Characteristics.....</b>	<b>53</b>
6.1 General.....	53
6.2 Pin and pair grouping assignment.....	53
6.3 Classification into climatic category.....	53
6.4 Electrical characteristics.....	55
6.5 Transmission characteristics.....	59
6.6 Mechanical.....	65
<b>7 Tests and test schedule.....</b>	<b>65</b>
7.1 General.....	65
7.2 Arrangement for contact resistance test.....	67
7.3 Arrangement for vibration test (test phase CP1).....	69
7.4 Test procedures and measuring methods.....	69
7.5 Preconditioning.....	69
7.6 Wiring and mounting of specimens.....	71
7.7 Test schedules.....	71
<b>Annex A (normative) Gauging continuity procedure.....</b>	<b>89</b>
<b>Annex B (normative) Locking-device mechanical operation.....</b>	<b>97</b>
<b>Annex C (normative) Test Plug requirements.....</b>	<b>99</b>
<b>Annex D (normative) General requirements for the measurement set-up.....</b>	<b>147</b>
<b>Annex E (normative) Insertion loss.....</b>	<b>157</b>
<b>Annex F (normative) Return loss.....</b>	<b>161</b>
<b>Annex G (normative) Near end cross talk (NEXT).....</b>	<b>165</b>
<b>Annex H (normative) Far end cross talk (FEXT).....</b>	<b>169</b>
<b>Annex I (normative) Transfer impedance.....</b>	<b>173</b>
<b>Annex J (normative) Transverse Conversion Loss (TCL) and Transverse Conversion Transfer Loss (TCTL).....</b>	<b>187</b>

Annexe K (normative) Sortie de symétriseur .....	192
Annexe L (normative) Exigences de calibre .....	196
Figure 1 – Vue isométrique .....	24
Figure 2 – Dimensions d'interface de contact avec fiche raccordée.....	26
Figure 3 – Détails de l'embase.....	32
Figure 4 – Vue de la fiche.....	36
Figure 5 – Calibre "entre".....	42
Figure 6 – Calibres "N'entrent pas" .....	44
Figure 7 – Calibres "N'entrent pas" .....	48
Figure 8 – Calibre "entre".....	50
Figure 9 – Affectation de groupement de broches et de paires pour embases (Vue de face du connecteur) .....	52
Figure 10 – Courbe du taux de réduction du connecteur .....	56
Figure 11 – Disposition pour l'essai de la résistance de contact.....	66
Figure 12 – Disposition pour l'essai de vibrations .....	68
Figure A.1 – Calibre.....	92
Figure A.2 – Insertion du calibre .....	94
Figure C.1 – Fiche de référence de désaccouplage .....	100
Figure C.2 – Embase de référence de désaccouplage .....	104
Figure C.3 – Fiche de référence de désaccouplage sans supports pour FEXT .....	114
Figure C.4 – Fiche de référence de désaccouplage FEXT avec embases.....	116
Figure C.5 – Fiche de référence pour FEXT accouplée à une carte de circuit imprimé .....	116
Figure C.6 – Position du fil de la fiche de référence pour la FEXT.....	118
Figure C.7 – Ensemble de fiche de référence pour la FEXT .....	118
Figure C.8 – Fils d'essai connectés à l'ensemble embase/carte de circuit imprimé désaccouplée de référence.....	122
Figure C.9 – Fiche de référence pour la FEXT accouplée à un ensemble embase/carte de circuit imprimé de référence.....	122
Figure C.10 – Éclaté de la tête d'essai de référence de la sortie coaxiale .....	126
Figure C.11 – Vue détaillée de l'interface de la tête d'essai de référence de la sortie coaxiale .....	126
Figure C.12 – Interface de tête d'essai THI3KIT avec symétriseurs montés .....	128
Figure C.13 – Alternative au point 3.1 du Tableau C.6 .....	132
Figure C.14 – Étalonnage direct dos à dos. ....	132
Figure C.15 – Configuration d'essai de tête d'essai de référence de fiche d'essai de sortie coaxiale accouplée.....	136
Figure D.1 – Hybride à 180° utilisé comme symétriseur .....	148
Figure D.2 – Étalonnage pour les charges de référence.....	150
Figure D.3 – Charge de résistance.....	152
Figure D.4 – Pyramide blindée.....	154
Figure D.5 – Définition des plans de référence.....	154
Figure E.1 – Étalonnage .....	156

Annex K (normative) Termination of balun .....	193
Annex L (normative) Gauge requirements .....	197
Figure 1 – Isometric view .....	25
Figure 2 – Contact interface dimensions with terminated free connector .....	27
Figure 3 – Fixed connector details .....	33
Figure 4 – Free connector view .....	37
Figure 5 – “Go” gauge .....	43
Figure 6 – “No-go” gauges .....	45
Figure 7 – “No-go” gauges .....	49
Figure 8 – “Go” gauge .....	51
Figure 9 – Fixed connector pin and pair grouping assignment (front view of connector) .....	53
Figure 10 – Connector de-rating curve .....	57
Figure 11 – Arrangement for contact resistance test .....	67
Figure 12 – Arrangement for vibration test .....	69
Figure A.1 – Gauge .....	93
Figure A.2 – Gauge insertion .....	95
Figure C.1 – De-embedding reference plug .....	101
Figure C.2 – De-embedding reference jack .....	105
Figure C.3 – De-embedding reference FEXT plug without sockets .....	115
Figure C.4 – De-embedding reference FEXT plug with sockets .....	117
Figure C.5 – Reference FEXT plug mated to PWB .....	117
Figure C.6 – Reference FEXT plug test lead position .....	119
Figure C.7 – Reference FEXT plug assembly .....	119
Figure C.8 – Test leads connected to de-embedded reference jack/PWB assembly .....	123
Figure C.9 – Reference FEXT plug mated to reference jack/PWB assembly .....	123
Figure C.10 – Exploded assembly of the coaxial termination reference test head .....	127
Figure C.11 – Detailed view of the coaxial termination reference test head interface .....	127
Figure C.12 – TH3KIT test head interface with baluns attached .....	129
Figure C.13 – Alternative to item 3.1 in Table C.6 .....	133
Figure C.14 – Back-to-back through calibration .....	133
Figure C.15 – Mated test plug/coaxial termination reference test head test configuration .....	137
Figure D.1 – 180° hybrid used as a balun .....	149
Figure D.2 – Calibration of reference loads .....	151
Figure D.3 – Resistor load .....	153
Figure D.4 – Screened pyramid .....	155
Figure D.5 – Definition of reference planes .....	155
Figure E.1 – Calibration .....	157

Figure E.2 – Montage de mesure .....	158
Figure G.1 – Mesure de la NEXT pour les sorties en mode différentiel et en mode commun.....	164
Figure H.1 – Mesure de la FEXT pour les sorties en mode différentiel et en mode commun.....	168
Figure I.1 – Préparation des éprouvettes .....	174
Figure I.2 – Montage d'essai triaxial.....	176
Figure I.3 – Adaptation d'impédance pour $R_1 < 50 \Omega$ .....	178
Figure I.4 – Adaptation d'impédance pour $R_1 > 50 \Omega$ .....	180
Figure J.1 – Mesure TCL .....	186
Figure J.2 – Mesure TCTL .....	188
Figure K.1 – Atténuateur équilibré pour prise centrale de symétriseur à la terre.....	192
Figure K.2 – Atténuateur équilibré pour prise centrale de symétriseur ouverte.....	194
Tableau 1 – Dimensions pour la Figure 2.....	28
Tableau 2 – Dimensions pour la Figure 3.....	34
Tableau 3 – Dimensions pour la Figure 4.....	38
Tableau 4 – Dimensions pour les Figures 5 et 6.....	46
Tableau 5 – Dimensions pour la Figure 7.....	48
Tableau 6 – Dimensions pour la Figure 8.....	50
Tableau 7 – Catégories climatiques – valeurs choisies .....	52
Tableau 8 – Lignes de fuite et distances d'isolement.....	54
Tableau 9 – Groupe d'essais P.....	72
Tableau 10 – Groupe d'essais AP.....	74
Tableau 11 – Groupe d'essais BP.....	78
Tableau 12 – Groupe d'essais CP.....	80
Tableau 13 – Groupe d'essais DP.....	82
Tableau 14 – Groupe d'essais EP.....	84
Tableau 15 – Groupe d'essais FP.....	86
Tableau 16 – Groupe d'essais GP.....	86
Tableau A.1 – Dimensions pour la Figure A.1 .....	90
Tableau C.1 – Vecteurs d'embase désaccouplée de référence imaginaire et réelle.....	108
Tableau C.2 – Limites de l'affaiblissement paradiaphonique de la fiche d'essai .....	110
Tableau C.3 – Gammes de l'affaiblissement paradiaphonique de la fiche d'essai.....	112
Tableau C.4 – Liste des composants de la tête de référence de sortie coaxiale .....	124
Tableau C.5 – Liste des composants de la tête de référence de sortie coaxiale .....	128
Tableau C.6 – Tête de référence de sortie coaxiale, pièces complémentaires.....	130
Tableau C.7 – Exigences FEXT de fiche d'essai – méthode de désaccouplage.....	138
Tableau C.8 – Vecteurs d'embase de référence en mode différentiel de catégorie 6.....	140
Tableau C.9 – Cohérence en mode différentiel et en mode différentiel avec commun de fiche d'essai.....	142
Tableau C.10 – Exigences d'affaiblissement de réflexion pour fiche de référence .....	144
Tableau D.1 – Caractéristiques des performances des symétriseurs d'essai .....	148



Figure E.2 – Measuring set-up .....	159
Figure G.1 – NEXT measurement for differential and common mode terminations .....	165
Figure H.1 – FEXT measurement differential and common mode terminations .....	169
Figure I.1 – Preparation of test specimen.....	175
Figure I.2 – Triaxial test set-up .....	177
Figure I.3 – Impedance matching for $R_1 < 50 \Omega$ .....	179
Figure I.4 – Impedance matching for $R_1 > 50 \Omega$ .....	181
Figure J.1 – TCL measurement .....	187
Figure J.2 – TCTL measurement.....	189
Figure K.1 – Balanced attenuator for balun centre tap grounded .....	193
Figure K.2 – Balanced attenuator for balun centre tap open.....	195
Table 1 – Dimensions for Figure 2 .....	29
Table 2 – Dimensions for Figure 3 .....	35
Table 3 – Dimensions for Figure 4 .....	39
Table 4 – Dimensions for Figures 5 and 6.....	47
Table 5 – Dimensions for Figure 7 .....	49
Table 6 – Dimensions for Figure 8 .....	51
Table 7 – Climatic categories – selected values.....	53
Table 8 – Creepage and clearance distances.....	55
Table 9 – Test group P .....	73
Table 10 – Test group AP.....	75
Table 11 – Test group BP.....	79
Table 12 – Test group CP.....	81
Table 13 – Test group DP.....	83
Table 14 – Test group EP.....	85
Table 15 – Test group FP.....	87
Table 16 – Test group GP.....	87
Table A.1 – Dimensions for Figure A.1.....	91
Table C.1 – De-embedded real and imaginary reference jack vectors .....	109
Table C.2 – Test plug NEXT loss limits .....	111
Table C.3 – Test plug NEXT loss ranges.....	113
Table C.4 – Coaxial termination reference head component list .....	125
Table C.5 – Coaxial termination reference head component list .....	129
Table C.6 – Coaxial termination reference head, additional parts.....	131
Table C.7 – Test plug FEXT requirements – de-embedding method .....	139
Table C.8 – Category 6 differential mode reference jack vectors.....	141
Table C.9 – Test-plug differential and differential with common-mode consistency.....	143
Table C.10 – Return loss requirements for return loss reference plug .....	145
Table D.1 – Test balun performance characteristics.....	149

Tableau F.1 – Bande d’incertitude de mesure d’affaiblissement de réflexion à des fréquences inférieures à 100 MHz..... 162

Tableau F.2 – Bande d’incertitude de mesure d’affaiblissement de réflexion à des fréquences supérieures à 100 MHz..... 162

Withdrawing

iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60603-7-5:2007](https://standards.iteh.ai/standards/iec/8162109b-cba7-40f8-a661-d60181da7bd0/iec-60603-7-5-2007)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/8162109b-cba7-40f8-a661-d60181da7bd0/iec-60603-7-5-2007>

Table F.1 – Uncertainty band of return loss measurement at frequencies below 100 MHz ..... 163

Table F.2 – Uncertainty band of return loss measurement at frequencies above 100 MHz ..... 163

Withheld

iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60603-7-5:2007](https://standards.iteh.ai/standards/iec/8162109b-cba7-40f8-a661-d60181da7bd0/iec-60603-7-5-2007)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/8162109b-cba7-40f8-a661-d60181da7bd0/iec-60603-7-5-2007>

# COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## CONNECTEURS POUR ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –

### Partie 7-5: Spécification particulière pour les fiches et les embases blindées à 8 voies pour la transmission de données à des fréquences jusqu'à 250 MHz

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les publications CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et elles sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toute divergence entre toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60603-7-5 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEI: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
48B/1741/FDIS	48B/1749/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT –

**Part 7-5: Detail specification for 8-way, shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 250 MHz**

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60603-7-5 has been prepared by subcommittee 48B: Connectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
48B/1741/FDIS	48B/1749/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60603, présentées sous le titre général *Connecteurs pour équipements électroniques*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date du résultat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEI à l'adresse suivante: "<http://webstore.iec.ch>", dans les données liées à la publication spécifique. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Withdrawing

iTech Standards  
(<https://standards.iteh.ai>)  
Document Preview

[IEC 60603-7-5:2007](https://standards.iteh.ai/standards/iec/8162109b-cba7-40f8-a661-d60181da7bd0/iec-60603-7-5-2007)

<https://standards.iteh.ai/standards/iec/8162109b-cba7-40f8-a661-d60181da7bd0/iec-60603-7-5-2007>